



CHIMIE DU SOLIDE CARACTÉRISATION DES SOLIDES PAR DIFFRACTION DES RAYONS X PAR LES POUDRES

PRÉSENTATION

Cette Formation Courte est divisée en 3 parcours pour 3 niveaux de formation disponibles :

- Niveau débutant : aspects fondamentaux et techniques liés à la technique de la diffraction des rayons X par la poudre et identifications de composés
- Niveau intermédiaire : aspects fondamentaux et techniques permettant l'extraction de paramètres structuraux
- Niveau confirmé : détermination structurales et application à différents types de solides (organiques, inorganiques et hybrides)

Un ou plusieurs parcours peuvent être suivis sur la même session de formation.

OBJECTIFS

- Mettre en œuvre des mesures de diffraction de rayons X sur des composés inorganiques, organiques ou hybrides sous forme pulvérulente
- Analyser un diffractogramme des rayons X sur poudre (qualitatif, (semi)quantitatif)
- Extraire des paramètres de maille, déterminer le groupe d'espace et réaliser un affinement par la méthode Le Bail
- Établir des modèles structuraux et les affiner par la méthode Rietveld

PUBLIC CIBLE

Techniciens, ingénieurs, doctorants.

Prérequis : Être titulaire d'un niveau BAC+2

Expérience professionnelle recommandée : en lien avec le domaine de la chimie du solide

RYTHME

Formation intégrale : 45 H (6 jours)

Formation par niveau : 15 H (2 jours)

SESSION

Second semestre 2026

TARIF

Formation intégrale
2 800 € Avec financement
1 200 € Autofinancement

Formation par niveau
1 200 € Avec financement
600 € Autofinancement

LIEU

IUT Montpellier-Sète
34 090 Montpellier

CONTACT

Salomé BESSAIH
salome.bessaih@umontpellier.fr



CHIMIE DU SOLIDE CARACTÉRISATION DES SOLIDES PAR DIFFRACTION DES RAYONS X PAR LES POUDRES

PROGRAMME

Le programme peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires. Les solutions mises à l'étude lors de l'expérimentation pratique peuvent être issues de cas concrets proposés par les stagiaires proposé avant la formation.

NIVEAU DÉBUTANT : 2 JOURS (15 heures)

- Atomes - Interaction matière/Rayons X
- Production des rayons X pour la diffraction
- Techniques de diffraction des rayons X
- Rappel des notions de cristallographie : nature de l'échantillon (Cristal, Vitrocéramique, Amorphe)
- Présentation générale d'un diffractomètre de rayons X sur poudre en géométrie Bragg-Brentano
- Préparation d'échantillons et acquisition
- Utilisation des logiciels pour le traitement des données de diffraction (DIFRAC.EVA) et utilisation des bases des données existantes (ICDD et COD).

NIVEAU INTERMÉDIAIRE : 2 JOURS (15 heures)

- Rappel des notions de cristallographie
- Principe de la mesure des diagrammes de diffraction & méthode Le Bail
- Préparation d'échantillons
- Acquisition (composés organiques, inorganiques ou hybrides)
- Affinement de diagrammes de diffraction X sur poudre de : composé monophasé, mélanges simples par utilisation de la méthode Le Bail

NIVEAU CONFIRMÉ : 2 JOURS (15 heures)

- Rappel des notions de cristallographie et paramètres instrumentaux
- Principe de méthode Rietveld : détermination de modèles structuraux et affinement de diffractogrammes affinements de diffractogrammes et quantification de mélanges complexes

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER